

2026年3月31日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
(コード:6920 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 横川 久
(TEL.045-478-7111)

新製品 マスク欠陥検査装置
MATRICS X712 シリーズを発表

【概要】

この度、レーザーテックはマスクショップおよびウェハファブの検査ニーズに対応するマスク欠陥検査装置 MATRICS X712 シリーズを製品化いたしました。

【内容】

ロジック、アナログ、ディスクリート、パワーデバイスなど多様なアプリケーションにおいて、>250nm～90nm クラスのデザインノードは依然として幅広く活用されており、マスク検査には高感度・短時間・低運用コスト(CoO)が求められています。

このようなニーズに対応すべく、MATRICS シリーズで培った光学系・画像処理・ユーザーインターフェース技術を基盤に MATRICS X712 シリーズを開発しました。266nm レーザーと専用アルゴリズムにより、DDB^{*1}/DD^{*2}/SD^{*3}の最大3モードを用途に応じて組み合わせることで、効率的な検査を実現するとともに、最短22分/マスクの高速検査を可能にしました。

本装置は5/6/7インチマスクに対応し、Cr・MoSi・OMOGなど主要材料をサポートしています。また、MEBES・OASISなどのDBフォーマットにも対応し、既存のデータフローとの親和性を確保しました。さらに、オートキャリブレーションや直感的なレシピユーザーインターフェース、複数装置のレシピ・検査結果を集中管理できるストアユニットなどを備え、現場での運用性を高めるソリューションも提供します。

レーザーテックは、今後もお客さまのご要望に応えるソリューション開発を通じて、品質改善と生産性向上に貢献してまいります。

【特 長】

- DDB/DD/SD の各検査モードを搭載
- >250nm～90nm の幅広いデザインノードに対応
- コンパクトなフットプリントと保守の容易さにより安定運用をサポート

【用 途】

- マスクの製造工程における異物検査および品質確認検査
- ウェハファブにおけるマスクの受入検査および定期的な品質確認検査

※1 DDB (Die-to-Database) 検査: 設計データとマスクパターンを比較し、設計値からの差異を検出する検査方式

※2 DD (Die-to-Die) 検査: 同一マスク上のチップパターン同士を比較し、相対的な欠陥を検出する検査方式

※3 SD (Single Die) 検査: 単一ダイを対象に欠陥を検出する検査方式



マスク欠陥検査装置 MATRICS X712 シリーズ

お問い合わせ先

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第1ソリューションセールス部 大野 雄哉

TEL: 045-478-7337

E-mail: sales@lasertec.co.jp